

(一財) ファインセラミックスセンター



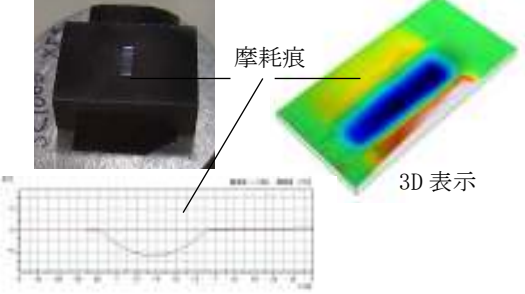
多様な規格に対応した表面形状が評価できます

三次元表面粗さ測定及び表面形状評価技術

技術分野分類 4403：薄膜・表面界面物性

技術キーワード 表面

産業分類 E-21：窯業・土石製品製造業、E-28：電子部品・デバイス・電子回路製造業

内 容	概 要	塗膜のキズ、うねりの有無、光沢などの表面性状は目視では認識できるものの、その数値化は困難であった。本評価技術では表面性状のデータを三次元解析することにより、多様な規格に対応した三次元粗さ及び凹凸部の体積などを迅速に解析できる。
	従来技術・ 競合技術 との比較 (優位性)	本解析技術は、三次元表面粗さ測定器を用いることにより、多様な規格*に対応した表面粗さが評価できるとともに、凹凸部の体積も評価できる。 *多様な規格：JIS- '82、'94、'01/'13、ISO- '84、'94、'97/'09、DIN-'90、ASME-'95/'02
	本技術の 有用性	本解析技術ではセラミックス研削面の評価(図-1 参照)及びセラミックス摩耗痕の評価(図-2 参照)が迅速にできる。詳細については、是非、(一財)ファインセラミックスセンターへご相談ください。
関連情報 (図・表・写真等)		 <p>粗さ測定</p> <p>＜図-1 セラミックス研削面の評価＞</p>  <p>断面測定</p> <p>＜図-2 セラミックス摩耗痕の評価＞</p>
適用可能製品		セラミックス、DLC 等のコーティング材及び摺動部材の摩耗痕等に適用できる。
技術 シース 保有者	氏名 所属・役職	林 一美 (一財) ファインセラミックスセンター 材料技術研究所 高信頼性グループ 上級技師補
技術 シース 照会先	窓口 TEL/FAX e-mail	(一財) ファインセラミックスセンター 研究企画部 052-871-3500/052-871-3599 techsup@jfcc.or.jp

■知的財産

■試作品状況

無

提示可

提供可

作成日 2015年 11月13 日